

## 8935

高生産性パターンウェーハ検査システムで、半導体チップの歩留りと信頼性に影響を及ぼす欠陥を検出します。

## メリット :

8935は高いスループットでのインライン欠陥検出、欠陥の自動分類機能により、自動車チップメーカーを支援します。

- チップの最終品質に影響を及ぼす可能性のある生産プロセスの問題を、正確に識別し迅速に解決する。
- 重要なプロセス工程に関し、すべてのウェーハについて100%のダイをモニターし、サプライチェーンで不良となるダイを出荷前に排除するゼロディフェクトスクリーニング戦略を採用することで、スクリーニングコストを最も低く抑えることができる。
- 拡張性が高く費用対効果の高いプラットフォームは、重大な欠陥を特定するための検査感度やAI技術、インラインモニターやスクリーニングに必要なスループットを有し、新規デバイスの生産およびより小型のデザインノードへの移行を加速する。

## テクノロジー :

- 高NA光学系によるマルチモードLEDスキャン機能
- 高解像度検査モード
- DefectWise® : AIベースの欠陥検出および自動欠陥分類技術
- DesignWise™ およびFlexPoint™: 高精度検査エリア設定技術
- 高度ノイズ抑制アルゴリズム
- I-PAT®インラインスクリーニングソリューション

## 用途 :

- エクスカーションリスク低減のための高サンプリング（ロットおよびウェーハ）でのインラインモニター。
- プロセス装置モニター
- 品質管理のための最終外観検査
- I-PATによるダイレベルの完全自動スクリーニングソリューション



## 市場 :

自動車、IoT、5G、民生品、工業（軍事、航空宇宙、医療）用など、デザインルールが比較的緩いデバイスのチップ製造

## プラットフォーム :

- カスタマイズ可能な構成
- 拡張可能
- アップグレード可能

## ウェーハのサイズ :

- 300mm
- 200mm
- 150mm

## 詳細情報 :

[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series)